

Formation TEST BOUNDARY SCAN

UNE APPROCHE PRATIQUE
6 participants - 2 jours - 1 enseignant



OBJECTIFS

Le test de carte rencontre aujourd'hui plusieurs problèmes technologiques dus essentiellement à l'implantation de plus en plus dense de composants de forte intégration.

Le test Boundary Scan est une approche du test de carte vous permettant d'accéder à l'ensemble des broches des composants numériques que composent votre carte.

Ce cours a pour but d'initier les participants, par une approche pratique, à la technologie du test Boundary Scan et la norme IEEE 1149.1

VOUS APPRENDREZ COMMENT

- Répondre aux problèmes test de cartes et composants.
- Maîtriser les atouts de la norme IEEE 1149.1
- Utiliser le Boundary Scan dans vos projets.
- Développer et mettre au point des programmes de test Boundary Scan.

A QUI S'ADRESSE CE STAGE

Ce stage s'adresse aux ingénieurs et aux techniciens de développement de test qui souhaitent améliorer la testabilité de leurs applications en intégrant et en utilisant la technologie Boundary Scan.

EXERCICES PRATIQUES

Chaque binôme de participant sera doté pendant toute la durée du stage d'un ordinateur muni d'un environnement de développement. Les exercices pratiques seront réalisés par les participants qui pourront ainsi mettre en application d'une manière concrète les éléments décrits dans le cours.

DOCUMENTS

L'ensemble des notes de cours comprenant les copies des transparents, les notes d'application, les articles techniques et les programmes étudiés pendant le stage vous sera remis dès le premier jour. Ce support vous apportera une aide précieuse pour intégrer avec succès le Boundary Scan dans vos applications.

INSCRIPTIONS / RESERVATIONS

Tél. : 01 30 51 21 00

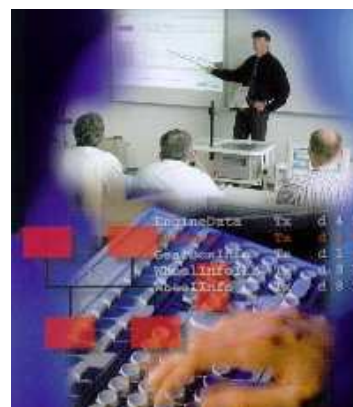
Email : dev@antycip.com

Lieu :



14 rue Panicale
78320 LA VERRIERE

<http://www.antycip.com/>



CONTENU DU COURS

I Introduction au test Boundary-Scan

- Définition de la fonction test
- Problèmes dus à l'évolution technologique
- Les différentes solutions de test
- La solution Boundary-Scan et historique de la norme IEEE 1149.1

II Le composant Boundary-Scan

- Synoptique du composant
- Le TAP (Test access port)
- Les registres d'instruction et de données
- Le jeu d'instructions
- Application sur un composant type JTAG

III Utilisation du composant JTAG

- Chaînage des composants JTAG
- Test d'interconnexion
- Bibliothèque de fonctions Scan
- Ecriture et mise au point d'un programme

IV Programmation de composants via le JTAG

- Programmation de composant mémoire
- Applications
- Exemples

V Bibliothèque JTAG

- Leste des composants JTAG
- Revue des composants spéciaux
- Approche hiérarchisée du test Boundary-Scan

